



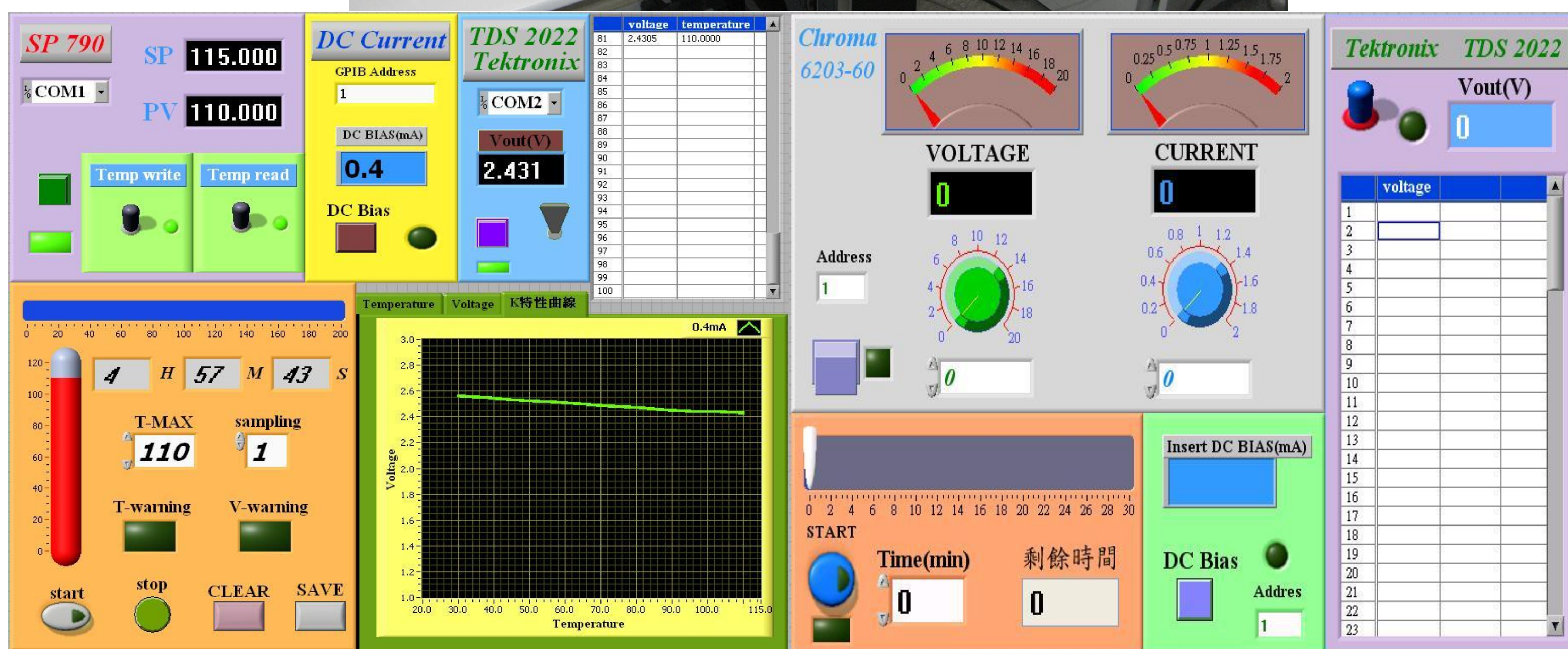
發光二極體之晶片溫度量測系統及量測方法

發明人: 鄭健隆

技術內容

一種發光二極體之晶片溫度量測系統及量測方法，係利用具有強大資料擷取與監控功能的開發程式開發出之人機介面與儀器硬體作溝通，藉由量測一待測發光二極體之順向電壓，進而計算出在該發光二極體受到驅動而正常發光之後，該發光二極體之晶片溫度，並藉由找出該發光二極體之最佳量測電流，使計算出之晶片溫度更加準確。

技術圖片



聯絡窗口：國立虎尾科技大學 智財技轉組 王偉儒

聯絡電話：05-6315561

網址：<http://nfu-test.eipm.com.tw/index.asp>